

早稲田大学大学院 経済学研究科

博士論文概要書

経済成長と有効需要不足

- 長期不況の動学理論 -

井上智洋

Tomohiro Inoue

理論経済学・経済史専攻

2011年6月

本論では技術進歩と市場調整が同時並行的に行われるモデルである「ハイブリッドモデル」を構築し、持続的な有効需要不足（ないし産出ギャップ）が発生する可能性を示す。

6つの章と補論から構成されており、第1章で本論のねらいと背景を示し、第2章から第5章で具体的なモデルを提示する。第6章で全体の結論をまとめる。補論で追加的な説明を行う。各章の具体的な内容は以下のとおりである。

第1章では、本論のねらいと背景について説明する。具体的には、既存理論における「長期」「短期」といったタイムスケールに応じた分割形式に対するこれまでの批判的研究を紹介する。そのうえでハイブリッドモデルの特徴を説明する。

第2章は、井上（2008a）に基づいており、基本的なハイブリッドモデルを提示している。そこでは、技術進歩と物価の粘着性が想定されている。労働市場の不均衡が許容されており、資本ストックや貨幣成長は存在しない。このようなモデルを用いた分析によって以下のことが示される。ピグー効果が作用するとともに絶えざる技術進歩が起きている経済では必ず過少雇用定常状態に陥る。

第3章は、井上（2008b）に基づいており、第2章のモデルを拡張している。そこでは、資本ストックを導入して生産関数をコブ＝ダグラス型に改めている。また、中央銀行によって貨幣成長率が設定されるものと仮定する。労働市場の不均衡と技術進歩が存在する点においては、第2章のモデルと変わらないが、粘着性は物価ではなく名目賃金率の方におかれている。このようなモデルを用いた分析によって、以下のことが示される。技術進歩率が貨幣成長率と等しいならば、完全雇用が実現する。技術進歩率が貨幣成長率より高いと過少雇用定常状態に陥る。

第4章は、Inoue and Tsuzuki（2010）に基づいており、DGEの枠組みに基づいた簡単なハイブリッドモデルを提示する。そこでは、技術進歩と物価の粘着性が想定されており、全ての市場が常に均衡している。資本ストックはここでは考慮しない。このようなモデルを用いた分析の結果、以下のことが示される。貨幣成長率を技術進歩率と等しくした時、定常状態における物価上昇率はゼロになり、産出ギャップは解消される。デフレーションの時や過度のインフレーションの時、現実の産出量は自然産出水準を下回る。

第5章では、井上（2008b）とTsuzuki and Inoue（2010）を組み合わせたモデルが提示される。それは、第4章のモデルの拡張であり、資本ストックが導入され、生産関数がコブ＝ダグラス型に改められている。また、粘着性は物価ではなく名目賃金率の方におかれている。分析の結果は第4章と同様であり以下の通りである。貨幣成長率を技術進歩率と等し

くした時、定常状態における物価上昇率はゼロになり、産出ギャップは解消される。デフレーションの時や過度のインフレーションの時、現実の産出量は自然産出水準を下回る。

第6章では、全体を通じた結論を述べる。すなわち、貨幣成長率は技術進歩率以上にすることが望ましく、貨幣成長率が技術進歩率より低ければ、長期的なデフレ不況が発生する。それはまた、主流派経済学の「長期には貨幣の超中立性が成り立つ」とか「長期には不況は存在せず新古典派成長理論が妥当する」といった主張に対する理論的な反駁となっている。

最後の補論では、ケインズ理論とフィリップス曲線を再検討することによって、本論が提示するモデルの含意を掘り下げるとともに、本論の第2章と第3章で採用した伝統的なフィリップス曲線の妥当性を主張する。

参考文献

- [1] 井上智洋 (2008a) 「技術的失業と Pigou 効果」『早稲田政治経済学雑誌』No.372、2-17 ページ。
- [2] 井上智洋 (2008b) 「技術進歩・有効需要不足・貨幣成長」『早稲田経済学研究』No.68、57-86 ページ。
- [3] Inoue, Tomohiro and Tsuzuki, Eiji (2010) “A New Keynesian Model with Technological Change,” *Economics Letters*, 110, 3, pp.206-208.
- [4] Tsuzuki, Eiji and Inoue, Tomohiro (2010) “Policy trade-off in the long run: A new Keynesian model with technological change and money growth,” *Economic Modelling*, 27, 5, pp.934-950.